PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-178152

(43) Date of publication of application: 02.08.1991

(51)Int.CI.

H01L 23/28

H01L 21/56

(21)Application number: 01-317030

(22)Date of filing:

(71)Applicant: SONY CHEM CORP

(72)Inventor: HIGUCHI SHIGETAKA

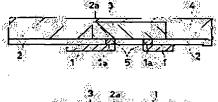
(54) MOLDED IC AND ITS MANUFACTURE

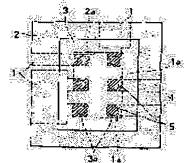
(57)Abstract:

PURPOSE: To make an IC light and thin, and realize easy mounting on various kinds of electronic circuit without having a retaining substrate, by retaining, with a specified positional relation, an IC bear chip and a conductive material layer formed in a specified pattern for wiring said chip, by using an insulating resin layer and a molded resin layer, and integrating them in a unified body.

06.12.1989

CONSTITUTION: In a molded IC, an insulating resin layer 2 is laminated on a conductive material layer 1 wherein a specified pattern is formed. Said resin layer 2 electrically insulates an IC bear chip 3 and the conductive material layer 1, and fixes the IC bear chip 3 with a specified positional relation. The IC bear chip 3 is mounted on the insulating resin layer 2, and at least a mounting surface of the IC bear chip 3 is unified in a body by a molded resin layer 4. An aperture 2a is formed in the insulating resin layer 2, and via the aperture 2a, the conductive material layer 1 and the IC bear chip 3 are electrically connected by using a conductive connection laver 5. Thereby a thin and light molded IC can be formed and easily mounted on other electronic circuit.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

[®] 公開特許公報(A) 平3-178152

19 Int. Cl. 1

識別記号

庁内整理番号

每公開 平成3年(1991)8月2日

H 01 L 23/28

Z R 6412-5F 6412-5F

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全7頁)

❷発明の名称

モールド【Cおよびその製造方法

②特 願 平1-317030

晃

図出 願 平1(1989)12月6日

個発明者 樋口

重 妾

東京都中央区日本橋室町1丁目6番3号 ソニーケミカル

株式会社内

切出 願 人

ソニーケミカル株式会

東京都中央区日本橋室町1丁目6番3号

}+

個代 理 人 弁理士 小池

外2名

明細書

1. 発明の名称

モールドICおよびその製造方法

2. 特許請求の範囲

- (1) 所定のパターンに形成された導電材料層と、 前記導電材料層の一部を露出させる関口部を有す る絶縁樹脂層と、前記絶縁樹脂層上に実装されそ の電極部が前記閉口部を通じて前記導電材料層と 電気的に接続されてなる「Cペアチップから構成 される積層体がモールド樹脂層により固着一体化 されてなることを特徴とするモールド「C。
- (2) 運電性基体上に運電材料層のパターンを反転 させたパターンを有するメッキレジスト層を形成 する工程と、

電解メッキにより前記事電性基件の露出部に専 電材料層を選択的に形成する工程と、

前記導電材料層のうちICベアチップの電極部 が接続される電気的接続部位に臨んで閉口される 隣口部を有する絶縁樹脂層を形成する工程と、

前記ICペアチップを前記絶縁樹脂層上に実装 し、前記間口部を通じて終ICペアチップの電極 部と前記導電材料層の電気的接続部位とを接続す る工程と、

前記導電性基体の少なくとも!Cペアチップ実 装面をモールド樹脂により固着する工程と、

少なくとも前記写電性基体を剝離する工程を有することを特徴とするモールド I C の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

〔度業上の利用分野〕

本発明は、IC (集積回路) ベアチップ。絶縁 層、配線層等からなる積層体がモールド樹脂によ り固着一体化されてなる軽量輝酸状のモールドI C、およびその製造方法に関する。

(発明の概要)

本発明は、ICベアチップとその配線を行うために所定のパターンに形成された導電材料層とを

特開平3-178152(2)

絶縁樹脂層およびモールド樹脂層により所定の位置関係に保持し、かつ固著一体化させることにより、支持基板を持たず軽量かつ薄型で、各種電子 回路に接続容易なモールド1 Cを提供しようとするものである。

本発明はさらに、上記モールド I C の製造を、 選択器光、電解めっき、印刷等の技術を組み合わ せ、高い信頼性、経済性、生産性をもって実現す るものである。

(従来の技術)

近年、各種電子機器の軽量化、小型化、薄型化、高機能化等に伴い、「C実装技術の分野においてもこれらを実現するための各種の技術が提案されている。フラットパッケージ等はその代表例である。さらに、高機能化、高集積化を目指して一てが多端子化され、かつ一層の軽量薄型化、低コスト化が図られるに伴い、これらの要請に対応し得る技術として、テープ自動ポンディング(TAB)法、チップ・オン・グラス(COC)法、チ

いても今ひとつ満足な結果が得られていない。

そこで本発明は、これらの問題点を解決し、極めて軽量薄膜化され、信盤性が高く、低コストで使い高いモールドIC、およびその製造方法を提供することを目的とする。

(蝶踞を解決するための手段)

本発明は上述の目的を達成するために提案されるものである。

すなわち、本発明の第1の発明にかかるモール ド【Cは、所定のパターンに形成された運電材料 層と、前記運電材料層の一部を露出させる開口部 を有する絶縁相別層と、前配絶縁樹脂層上に実装 されその電極部が前記関口部を通じて前記準電材 料層と電気的に接続されてなる【Cベアチップか ら構成される積層体がモールド樹脂層により固着 一体化されてなることを特徴とするものである。

さらに、本発明の第2の発明にかかるモールド 1Cの製造方法は、導電性基体上に導電材料層の パターンを反転させたパターンを有するメッキレ

ップ・オン・フレキシブル・ブリント・サーキッ ト (COP) 法、フェース・ポンディング法等の 技術も提案されている。TAB怯は、ポリイミド 谷からなるテープの表面に予めエッチングにより 形成された湖の配線パターンに、ICベアチップ 上のパンプを熱圧着もしくは共晶法により接続す る方法である。COC法は、ガラス基板上におい て欲品マトリクス等から導出された透明電極にJ Cベアチップの嫡子を接続する方法である。CO P法はポリエステル。ポリイミド等の高分子材料 からなるフィルム上に形成された配線パターンに ICペアチップを接続する方法である。フェース ・ポンディング法は半導体チップをステムに組み 立てる際や厚膜ICに組み込む際の接続を、線に よらず固で行う方法であり、フリップチップにお いて実用化されている。

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら、上述の各方法ではコストの上昇 や使用目的の制約を生ずる他、特度や信頼性にお

(作用)

本発明にかかるモールドICは、ICペアチップとその配線を行うために所定のパターンに形成された導電材料層とが絶貨樹脂層およびモールド樹脂層により所定の位置関係に保持され、かつ固着一体化されてなるものである。上記モールドICは、何ら支持基板を有さず導電材料層がICペ

特別平3-178152(3)

アチップの実装団とは反対側の節に露出されているため、この形のままで極めて容易に他の電子回路に実装することができる。しかも、その全厚はほぼ1 Cベアチップ自身の厚さにより決まるものである。このように、本発明のモールド I C は価めて再型かつ軽量であるが、その機械強度は上配的報酬階級層およびモールド樹脂層により十分に保障されているので、信銀性の面でも問題はない。

プ(3) を所定の位置関係を保って固定するための 絶縁樹脂層(2) が積層され、さらに上記絶縁樹脂 層(2) の上に1Cベアチップ(3) が載置され、少 なくとも上記1Cベアチップ(3) の実装面がモー ルド樹脂層(4) により固着一体化されてなるもの である。上記絶縁樹脂層(2) には閉口部(2a)が設 けられており、この開口部(2a)を選じて導電接続 層(5) により上記導電材料層(1) と1Cベアチップ(3) の電気的接続が図られている。

ここで、上記準電材料層(1) とICベアチップ
(3) の接続状態をよりわかり易く説明するために、第2図にはICベアチップ(3) の実装部近傍の模式的な上面図を示す。ただし、図面を簡単とするために、最上部のモールド樹脂層(4) は図示しない。上記準電材料層(1) は、ICベアチップ(3) の配線層として機能するべく所定のパターンに形成された金属環膜であり、線パターンを構成する各配線層の末端部は電気的接続部位(14)とされている。この図に示す例では、I個のICベアチップ(3) に対して6個の電気的接続部位(15)が、線

形成するための印刷工程、I C ペアチップを実築するためのポンディング工程、モールド樹脂の使布工程等の必要最小限の工程からなり、従来の製造設備に何ら特殊な設備を追加することなく容易に実施でき、信候性の高いモールドI C を参習り良く製造することができる。

(実施例)

以下、本発明の好適な実施例について、図面を 参照しながら説明する。

実路例 i

本実施例は、『Cベアチップと導電材料層の間. の電気的接続を導電接続層を介して図ったモール FICおよびその製造方法の例である。

まず、第1回に本実施例にかかるモールド I C は、所定の機略新田図を示す。このモールド I C は、所定のパターンに形成された運電材料層(1) の上に、 後述の I C ペアチップ(3) と上記導電材料層(1) との間の電気的絶縁を図り、かつ核 I C ペアチッ

「Cベアチップ(3) の6個の電極部(3a)の配設パターンに対応して設けられている。上記絶縁樹脂層(2) には、上記電気的接続部位(1a)の全てを露出させる関口部(2a)が設けられている。したがって、絶縁樹脂層(2) を形成した及階で、閉口部(2a)内に露出する電気的接続部位(1a)に適当な方法により導電接続層(5) 【図中、斜線部で示す。】を形成し、さらに上記閉口部(2a)に臨んで【Cベアチップ(3】を実装すれば、験【Cベアチップ(3)は外周部を絶縁樹脂層(2) により支持されると共に、準電材料層(1) と電気的および軽減的に接続される

かかるモールドICは、何ら支持基板を有するものではなく、導電材料層(1) が「Cベアチップ(3) の実装面とは反対側の面に露出されているため、この形のままで極めて容易に他の電子回路に実装することができる。しかも、上述の導電材料層(1) や絶縁樹脂層(2) はいずれも極めて深い層であるため、モールドICの全厚はほぼ「Cベアチップ(3) の厚さにより決まると言って良い。し

かし、上記モールドICはこのように極めて薄型 でありながら、その機械強度は上記絶縁樹脂層お よびモールド樹脂層(4) により十分に保障されて いる。

上述のようなモールド | C は、たとえば第3図 (A) ないし第3図 (F) に示す製造工程により製造することができる。

まず、第3図(A)に示すように、導電性基体 (6)上に、最終的に形成される導電材料層(1)の パターンを反転させたパターンを有するメッキレ ジスト層(7)を形成する。

ここで、上記事電性基体(6) としては、次の工程にてこの上に形成される事電材料層(1) が容易に制離できるような平滑面を有することが必要であり、その材料もステンレス個。ニッケル。チタン、ニッケル系合金。チタン系合金。ニッケルーコバルト合金。その他の合金等から適宜選択することができる。ここでは、厚さ50gmのSUS304スチンレス個板を使用した。

また、上紀メッキレジスト層(7) は、絶縁性。

性基体(6) に対する副離性の高い材料を使用する必要がある。好通な金属としては金、銀、網、クロム、ニッケル、鉄、コバルト、あるいはこれらの合金等が挙げられるが、ここでは、次のような条件により網を折出させた。すなわち、電解液14当たり硫酸網250g、碳酸75gを含む硫酸網絡を使用し、波温25℃、電波密度8A/dm¹、メッキ時間30分の条件で電解メッキを行った。

なおここで、必要に応じて電解メッキの前後で 防錆処理を行うこともできる。また、後の工程で 実装される I Cベアチップ(3) との接続を図るた めの導電接続層(4) としてバンプが形成される場 合には、この設計で上記導電材料層(1) の電気的 接続部位(1a)に金。半田、基電性ペースト等から なるバンプを形成しても良い。本実施例では、金 バンプを形成した。

次に、第3回(C)に示すように、前記導電材料層(1)と1Cベアチップ(3)の間において電気的接続部位(1a)以外の部位における電気的機構を図り、かつ線1Cベアチップ(3)を所定の位置関

耐熱性、および後の工程で使用される電解メッキー 被に対する耐性、すなわち耐酸性もしくくは耐アル カリ性を有する材料により形成される上記ががが、上記メッキレジスト層(7)が、 型造工程性基体(6)を頻離される場合により無理性基体(6)を共に剝離される場合にないが、 型が関としての機能も果たすが、から、 を関係していたとえばレジストが制造した。 は、これを元のパクーンに形成すれば、 と光光では、レジストが料(度レシリコンとの の形式は、レジストを使用し、これをいる ここ SB 9558 BTV)を使用し、これをし、 リーン印刷により15μmの厚さに使布した。

次に、第3図(B)に示すように、金属メッキ 俗に慢渡して電解メッキを行い、導電性基体(6)の表面のうちメッキレジスト層(7)によりマスク されずに露出している部分に選択的に金属を折出させ、導電材料層(1)を形成する。上記金属としては、高い導電性を有し、かつ最終的に上記導電性基体(6)から剝離されることを考慮して該導電

係に固定保持するための絶縁樹脂層 (2) を形成する。本実施例における上記絶縁樹脂層 (2) は、1 Cベアチップ (3) の電極部(第2 図の (3a) 参照。)の配設パターンに応じて閉口される閉口部 (2a) を有しており、この内部において運電材料層 (1) と1 Cベアチップ (3) との間の電気的接続が図られる。この絶縁樹脂層 (2) の材料としては、電気絶縁性以外に、優れた耐熱性および耐平田性を有していることが必要である。本実施例では、レジストインキ(タムラ化学社製、商品名 SR-29G)を使用し、これをシルクスクリーン印刷により15 μmの厚さに塗布することにより、上記絶縁樹脂層 (2) を発向した。

次に第3図(D)に示すように、ICベアチップ(3)をその電極部(第2図の(3a)参照。)が予め専電技統層(5)として金パンプが形成された上記電気的接続部位(1a)に合致するように画像処理装置を使用して製置し、フェースポンダーにより接続した。これにより、ICベアチップ(3)は上記開口部(2a)を通じて電気的に導電材料層(1)と

特別平3-178152(6)

接続されると共に、機械的にも固定される。

なお、上述のようなパンプによる接続以外にも、 使用する I Cベアチップ(3) のタイプによっては 異方性導電膜や導電性接着剤等による接続が可能 である。

* 2 1

次に、第3図(E)に示すように、終ICペアチップ(3)の実装面をモールド樹脂層(4)により固着する。ここでは、上記モールド樹脂層(4)を形成するためのモールド樹脂名XA 5569)を使用した。すなわち、上記ポリカレタン社製、商品ステル系樹脂(100重都につき硬化剤(日本ポリカレタン社製、商品名コロネートを混合してなる強料をしてベアチップ(3)がほぼ症われる程度により、薬電電材料層(1)、能機構層(5)からなる機層体が固着により、検練層(1)、とICペアチップ(3)より完全に便化高により、マアキュ料層(1)、接換機層(5)からなる機層体が固着により、減減電材料層(1)、とICペアチップ(3)、および導電材料層(1)、とICペアチップ(3)との間の確実な電気的、機械的接続が保証される。

断面図を示す。このモールドICは、所定のパターンに形成された導電材料層(11)の上に、後述のICペアチップ(13)と上記導電材料層(11)との間の電気的絶縁を図り、かつ該ICペアチップ(13)を所定の位置関係を保って固定するための絶縁樹脂層(12)が積層され、さらに上記絶縁樹脂層(12)の上にICペアチップ(13)が載置され、少なくとも上記ICペアチップ(13)の実装面がモールド樹脂層(14)により固着一体化されてなるものである。上記絶縁樹脂層(12)には関口部(12a)が設けられており、この関口部(12a)を選じてワイヤ(15)により上記導電材料層(11)とICペアチップ(13)の電気的接続が図られている。

かかるモールドICの製造方法は、前述の事電 接続層(5)を形成する代わりに金線等のワイヤ (15)を使用してワイヤボンディングを行った他は ほぼ実施例1に上述したとおりであるので、詳し い処明は省略する。

(発明の効果)

最後に、第3回(F)に示すように、モールド 樹脂層(4) により固着一体化された上述の種層体から課性基体(6) とメッキレジスト層(7) を射 酸し、前述の第1回に示したようなモールド I C を得た。ここで、メッキレジスト層(7) が導電性 各体(6) に対して高い軽離性を有し、剝離時も多いが、 なっキレジスト層(7) が積層体側に残存する。これは、 がは、過当なな方法によりこれを対する。この基準によりこれをは、、 でするれたモールド I C に、アチップ(3) を育しないを呼がはば I C ペアチップ(3) を同じため、全厚がされており、かつ軽量である。しかし、その機械強度は上記総縁間間層(2) およびモールド樹脂層(4) により十分に高いものである。

実施例2

本実施例は、1Cペアチップと運電材料層の間の電気的接続をワイヤボンディングにより図ったモールドICの例である。

第4図に本実施例にかかるモールド「Cの機略

以上の説明からも明らかなように、本発明にかかるモールド』Cは、極めて軽量薄型であり、各種の小型化された電子機器に使用される電子固路に容易に実装可能なものである。また、本発明にかかる製造方法では、支持基板上おいて上記モールド』Cの各構成要素を形成するための加工、処理が施されるため、極めて特度、信頼性の高いモールド』Cを容易に、しかも高い経済性、生産性をもって製造することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明にかかるモールドICの一様成例を模式的に示す帳略所面図であり、第2図は上記モールドICのICペアチップの実装部近待を示す上面図である。第3図(A)ないし第3図(P)は、本発明にかかるモールドICの製造方法の一例をその工程順にしたがって示す機略断面図であり、第3図(A)は運賃性基体上におけるメッキレジスト層の形成工程、第3図(B)は電解メッキによる運電材料層の形成工程、第3図

特別平3-178152(6)

(C) は絶縁樹脂層の形成工程、第3図(D) は 1 Cペアチップの実装工程、第3図(B) はモールド樹脂層の形成工程、第3図(P) は課電性基体およびメッキレジスト層の刺離工程をそれぞれ示す。第4図は本発明にかかるモールドICの他の構成例を模式的に示す機略断面図である。

4 e¹ 4



la --- 電気的接続部位

2, 12 · · · • • • 申 申 申 用

2a, 12a ··· 57 □ 65

3. 13 ... ICペアチップ

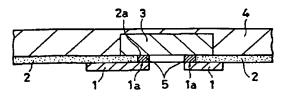
3. ... 電極部

4, 14 ・・・ モールド樹脂層

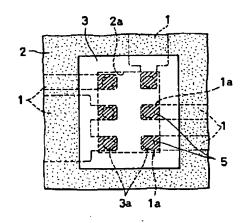
15 ・・・ ワイヤ

6 --- 漢電性基体

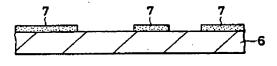
7 ・・・ メッキレジスト層



第 1 図



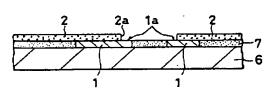
第 2 図



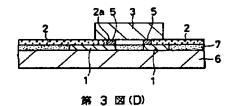
第 3 図(A)

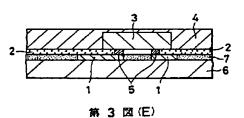


第 3 図(B)



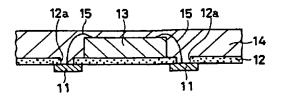
第 3 図(C)





2 2 2 2 6

第 3 図(F)



盆 ム 図